Dual In-Line Package



800V **1A**

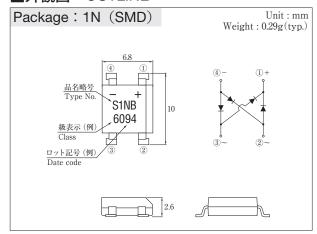
特 長

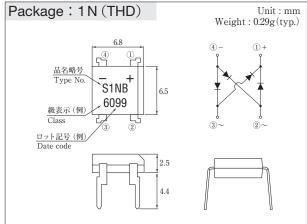
・小型 DIP パッケージ

Feature

• Small-DIP

■外観図 **OUTLINE**





外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下 さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tl = 25°C / unless otherwise specified)

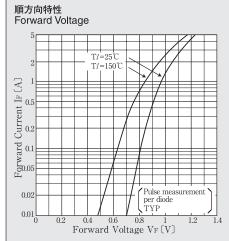
| 項 目 Item | 記号 Symbol | 条件 Type No. | S1NB60 | S1NB80 | 単位 Unit |
|---|--------------|---|---------------------------------|--------|------------------|
| 保存温度 Storage Temperature | Tstg | | -40~150 | | $^{\circ}$ |
| 接合部温度 Operation Junction Temperature | Tj | | 150 | | °C |
| せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage | Vrm | | $\underset{(V_{RSM}=700)}{600}$ | 800 | V |
| 出力電流 Average Rectified Forward Current | Io | 50Hz 正弦波,抵抗負荷,プリント基板実装, Ta=25℃ 50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate, Ta=25℃ | 1 | | A |
| せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current | IFSM | 50Hz 正弦波, 非繰り返し1 サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃ | 30 | | A |
| 電流二乗時間積 Current Squared Time | I²t | 1ms≦t<10ms,Tj=25℃, 1素子当たりの規格値 per diode | 4.5 | | A ² s |

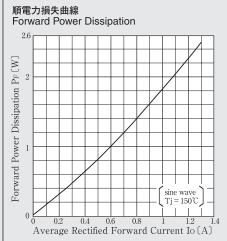
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tl = 25 \mathbb{C} / unless otherwise specified)

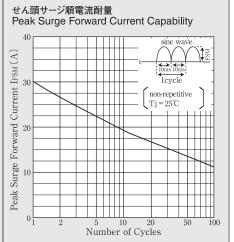
| 順電圧 Forward Voltage | VF | ${ m IF}$ = $0.5{ m A}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 1.05 | V | |
|---------------------------|----------------|--|----------|-------|--|
| 逆電流 Reverse Current | IR | $V_R\!=\!V_{RM}$, パルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode | MAX 10 | μΑ | |
| 熱抵抗 Thermal Resistance | θ j l | 接合部・リード間 Junction to Lead | MAX 15 | °C/W | |
| | θја | 接合部・周囲間 Junction to Ambient | MAX 68 |] C/W | |

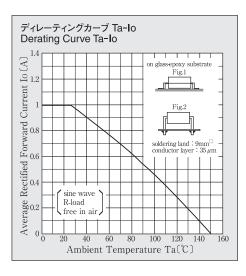
18

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS









^{*} Sine wave は 50Hz で測定しています。

^{* 50}Hz sine wave is used for measurements.

^{*}半導体製品の特性は一般的にバラッキを持っております。 Typical は統計的な実力を表しています。

^{*} Semiconductor products generally have characterristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.